

Obtención de imágenes topográficas de bicapas soportadas mediante microscopía de fuerza atómica y conductancia iónica

En la última década la microscopía de fuerza atómica ha surgido como una herramienta muy versátil para el estudio de muestras biológicas como células o tejidos ya sea para la toma de imágenes topográficas o la medición de propiedades mecánicas. Una extensión de la microscopía de fuerza atómica es la de conductancia iónica que se basa en la medición de variación en una corriente muy pequeña para la toma de imágenes topográficas. A pesar de que esta técnica es realmente de no-contacto no ha sido muy utilizada en las ciencias biológicas. En este trabajo se muestran los primeros resultados de la toma de imágenes de bicapas soportadas sobre mica evaluadas tanto con microscopía de fuerza atómica como con conductancia iónica, con la cual se pueden además estimar propiedades eléctricas de superficie.

Resumen de la contribución

Author: DOMÍNGUEZ REYES, Rebeca (ICF, UNAM)

Presenter: DOMÍNGUEZ REYES, Rebeca (ICF, UNAM)